

**Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский физико-технический институт  
(национальный исследовательский университет)»**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Директор физтех-школы  
электроники, фотоники и  
молекулярной физики**

**В.В. Иванов**

	<b>Рабочая программа дисциплины (модуля)</b>
<b>по дисциплине:</b>	Методы сканирующей зондовой, оптической и электронной микроскопии
<b>по направлению:</b>	Материаловедение и технологии материалов
<b>профиль подготовки:</b>	Науки и цифровизация в культурном наследии Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики кафедра химической физики
<b>курс:</b>	1
<b>квалификация:</b>	магистр

Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Дифференцированный зачет

Аудиторных часов: 30 всего, в том числе:

лекции: 30 час.

семинары: 0 час.

лабораторные занятия: 0 час.

Самостоятельная работа: 15 час.

Всего часов: 45, всего зач. ед.: 1

Программу составил: В.А. Надточенко, д-р хим. наук, профессор

Программа обсуждена на заседании кафедры химической физики 27.05.2021

## Аннотация

Курс "Методы сканирующей зондовой, оптической и электронной микроскопии" предусматривает ознакомление с современными методами зондовой, оптической и электронной микроскопии.

### 1. Цели и задачи

#### Цель дисциплины

Целью курса является ознакомление с современными методами зондовой, оптической и электронной микроскопии.

#### Задачи дисциплины

Ознакомить студентов с принципами, лежащими в основе зондовой, оптической и электронной микроскопии и их применении в исследованиях объектов культурного наследия.

### 2. Перечень формируемых компетенций

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-1 Способен ставить, формализовывать и решать задачи, в том числе разрабатывать и исследовать математические модели изучаемых явлений и процессов, системно анализировать научные проблемы, получать новые научные результаты	ПК-1.1 Способен находить, анализировать и обобщать информацию об актуальных результатах исследований
	ПК-1.2 Способен выдвигать гипотезы, строить математические модели для описания изучаемых явлений и процессов, оценивать качество разработанной модели
	ПК-1.3 Способен применять теоретические и (или) экспериментальные методы исследований к конкретной научной задаче и интерпретировать полученные результаты
ПК-3 Способен профессионально работать с исследовательским и испытательным оборудованием (приборами и установками, специализированными пакетами прикладных программ) в области материаловедения и технологии материалов	ПК-3.1 Понимает принципы работы используемого оборудования (специализированных пакетов прикладных программ)
	ПК-3.2 Способен проводить эксперимент (моделирование) с использованием исследовательского оборудования (пакетов прикладных программ)
	ПК-3.3 Способен оценивать точность полученных экспериментальных (численных) результатов

### 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны

знать:

- современные возможности методов сканирующей зондовой, оптической и электронной микроскопии.

уметь:

- планировать стратегию установления повреждений произведений изобразительного искусства;
- обрабатывать экспериментальные данные, полученные с помощью физико-химических методов исследования вещества с использованием основных методологических принципов;
- использовать современные приборы и методики, проводить и организовывать эксперименты,
- готовить образцы для проведения различных исследований свойств и структуры материалов.

владеть:

- теоретическими знаниями строения вещества о взаимодействии света с веществом;
- практическими навыками интерпретации экспериментальных данных о спектрах, составе и морфологии вещества, практическими знаниями о методах сканирующей зондовой, оптической и электронной микроскопии;
- методологией сопоставления и критической интерпретации массива данных, полученных всей совокупностью использованных физико-химических и математических методов исследования строения и состава вещества.

#### 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

##### 4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№	Тема (раздел) дисциплины	Трудоемкость по видам учебных занятий, включая самостоятельную работу, час.			
		Лекции	Семинары	Лаборат. работы	Самост. работа
1	Современные методы оптической нелинейно-оптической и когерентной оптической микроскопии	6			2
2	Оптическая микроскопия одиночных молекул	8			4
3	Методы зондовой микроскопии	8			4
4	Методы электронной микроскопии	8			5
Итого часов		30			15
Подготовка к экзамену		0 час.			
Общая трудоёмкость		45 час., 1 зач.ед.			

##### 4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

###### Семестр: 2 (Весенний)

###### 1. Современные методы оптической нелинейно-оптической и когерентной оптической микроскопии

Микроскопия субдифракционного разрешения – микроскопия ближнего поля и нелинейная оптическая микроскопия.

Оптические методы визуализации материалов и биотканей, лазерная диагностика. Современные маркеры для оптической микроскопии на основе пигментов, квантовых точек, люминесцентных наночастиц, плазмонных наночастиц, цветных люминесцентных маркеров

###### 2. Оптическая микроскопия одиночных молекул

Микроскопия с использованием оптических зондов и принципов диполь-дипольного переноса энергии FRET (резонансного переноса энергии по Фёрстеру).

###### 3. Методы зондовой микроскопии

Техника сканирующей зондовой микроскопии. Атомно-силовая микроскопия, электросиловая микроскопия, магнито-силовая микроскопия, сканирующая туннельная микроскопия, ближнепольная оптическая микроскопия

#### 4. Методы электронной микроскопии

Сканирующая электронная микроскопия SEM, просвечивающая электронная микроскопия ТЕМ

### 5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебная аудитория, снабженная доской, экраном, проектором.

### 6. Перечень рекомендуемой литературы

#### Основная литература

1. Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов и наноструктур [Текст] / С. А. Рыков ; под общ. ред. В. И. Ильина, А. Я. Шика - СПб. Наука, 2001
2. Основы сканирующей зондовой микроскопии [Текст] / В. Л. Миронов ; Рос. акад. наук, Ин-т физики микроструктур - М. Техносфера, 2004
3. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия [Текст] / Л. В. Вилков, Ю. А. Пентин - М. Высшая школа, 1987
4. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ в примерах практического применения [Текст] / М. М. Криштал [и др.] - М. Техносфера, 2009

#### Дополнительная литература

1. Сканирующая туннельная микроскопия / М-во науки и высш. образования РФ, Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т), Каф. вакуумной электроники ; сост.: А. А. Чуприк, Е. П. Шешин , М., МФТИ, 2018

### 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Не используются

### 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Не предусмотрено.

### 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Студент, изучающий дисциплину, должен с одной стороны, овладеть общим понятийным аппаратом, а с другой стороны, должен научиться применять теоретические знания на практике. В результате изучения дисциплины студент должен знать основные определения дисциплины, уметь применять полученные знания для решения различных задач.

Успешное освоение курса требует:

- посещения всех занятий, предусмотренных учебным планом по дисциплине;
- ведения конспекта занятий;
- напряжённой самостоятельной работы студента.

Самостоятельная работа включает в себя:

- чтение рекомендованной литературы;

- проработку учебного материала, подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения;
- решение задач, предлагаемых студентам на занятиях;
- подготовку к выполнению заданий текущей и промежуточной аттестации.

Показателем владения материалом служит умение без конспекта отвечать на вопросы по темам дисциплины.

Важно добиться понимания изучаемого материала, а не механического его запоминания. При затруднении изучения отдельных тем, вопросов, следует обращаться за консультациями к преподавателю.

Возможен промежуточный контроль знаний студентов в виде решения задач в соответствии с тематикой занятий.

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

<b>по направлению:</b>	Материаловедение и технологии материалов
<b>профиль подготовки:</b>	Науки и цифровизация в культурном наследии Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики кафедра химической физики
<b>курс:</b>	1
<b>квалификация:</b>	магистр
Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Дифференцированный зачет	
<b>Разработчик:</b>	В.А. Надточенко, д-р хим. наук, профессор

## 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-1 Способен ставить, формализовывать и решать задачи, в том числе разрабатывать и исследовать математические модели изучаемых явлений и процессов, системно анализировать научные проблемы, получать новые научные результаты	ПК-1.1 Способен находить, анализировать и обобщать информацию об актуальных результатах исследований
	ПК-1.2 Способен выдвигать гипотезы, строить математические модели для описания изучаемых явлений и процессов, оценивать качество разработанной модели
	ПК-1.3 Способен применять теоретические и (или) экспериментальные методы исследований к конкретной научной задаче и интерпретировать полученные результаты
ПК-3 Способен профессионально работать с исследовательским и испытательным оборудованием (приборами и установками, специализированными пакетами прикладных программ) в области материаловедения и технологии материалов	ПК-3.1 Понимает принципы работы используемого оборудования (специализированных пакетов прикладных программ)
	ПК-3.2 Способен проводить эксперимент (моделирование) с использованием исследовательского оборудования (пакетов прикладных программ)
	ПК-3.3 Способен оценивать точность полученных экспериментальных (численных) результатов

## 2. Показатели оценивания компетенций

В результате изучения дисциплины «Методы сканирующей зондовой, оптической и электронной микроскопии» обучающийся должен:

### знать:

- современные возможности методов сканирующей зондовой, оптической и электронной микроскопии.

### уметь:

- планировать стратегию установления повреждений произведений изобразительного искусства;
- обрабатывать экспериментальные данные, полученные с помощью физико-химических методов исследования вещества с использованием основных методологических принципов;
- использовать современные приборы и методики, проводить и организовывать эксперименты,
- готовить образцы для проведения различных исследований свойств и структуры материалов.

### владеть:

- теоретическими знаниями строения вещества о взаимодействии света с веществом;
- практическими навыками интерпретации экспериментальных данных о спектрах, составе и морфологии вещества, практическими знаниями о методах сканирующей зондовой, оптической и электронной микроскопии;
- методологией сопоставления и критической интерпретации массива данных, полученных всей совокупностью использованных физико-химических и математических методов исследования строения и состава вещества.

## 3. Перечень типовых (примерных) вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

С целью контроля освоения обучающимися учебного материала проводится устный опрос в начале занятия по теме прошлой лекции или в конце занятия по пройденной теме.

#### 4. Перечень типовых (примерных) вопросов и тем для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы для проведения дифференцированного зачета:

1. Современные методы оптической нелинейно-оптической и когерентной оптической микроскопии.

Микроскопия субдифракционного разрешения – микроскопия ближнего поля и нелинейная оптическая микроскопия.

2. Оптические методы визуализации материалов и биотканей, лазерная диагностика. Современные маркеры для оптической микроскопии на основе пигментов, квантовых точек, люминесцентных наночастиц, плазмонных наночастиц, цветных люминесцентных маркеров

3. Оптическая микроскопия одиночных молекул. Микроскопия с использованием оптических зондов и принципов диполь-дипольного переноса энергии FRET (резонансного переноса энергии по Фёрстеру)

4. Методы зондовой микроскопии. Техника сканирующей зондовой микроскопии

5. Методы зондовой микроскопии. Атомно-силовая микроскопия

6. Методы зондовой микроскопии. Электросиловая микроскопия

7. Методы зондовой микроскопии. Магнито-силовая микроскопия

8. Методы зондовой микроскопии. Сканирующая туннельная микроскопия

9. Методы зондовой микроскопии. Ближнепольная оптическая микроскопия

10. Методы электронной микроскопии – SEM, TEM

11. Химическое картирование объекта методами масс-спектропии (TOF-SIMS)

12. Химическое картирование объекта методами ИК-микроскопии

13. Химическое картирование объекта методами микроскопии комбинационного рассеяния

14. Химическое картирование объекта методами фемтосекундной микроскопии комбинационного рассеяния

#### Критерии оценивания

Оценка отлично 10 баллов - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины, проявляющему интерес к данной предметной области, продемонстрировавшему умение уверенно и творчески применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка отлично 9 баллов - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка отлично 8 баллов - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, правильное обоснование принятых решений, с некоторыми недочетами.

Оценка хорошо 7 баллов - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но недостаточно грамотно обосновывает полученные результаты.

Оценка хорошо 6 баллов - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности.

Оценка хорошо 5 баллов - выставляется студенту, если он в основном знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач достаточно большое количество неточностей.

Оценка удовлетворительно 4 балла - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он освоил основные разделы учебной программы, необходимые для дальнейшего обучения, и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.



Оценка удовлетворительно 3 балла - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, допускающему ошибки в формулировках базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, слабо владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и с трудом применяет полученные знания даже в стандартной ситуации.

Оценка неудовлетворительно 2 балла - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных принципов и не умеет использовать полученные знания при решении типовых задач.

Оценка неудовлетворительно 1 балл - выставляется студенту, который не знает основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубейшие ошибки в формулировках базовых понятий дисциплины и вообще не имеет навыков решения типовых практических задач.

## **5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

При проведении устного дифференцированного зачета обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном дифференцированном зачете не должен превышать одного астрономического часа.